

第7回 MIRCフォーラム

～光電子分光・顕微が開く最先端ナノ計測技術～

低炭素化社会の実現に向け機能を最大化するための素材開発はますます重要になってきています。これは環境分野だけでなく最先端半導体・パワーデバイスなどにも及んでおり、それと共に機能を可視化するナノ計測技術の開発も急務となっております。光電効果を利用した顕微技術・分光技術は近年、単なる元素分析の手法からナノ構造・ナノ機能の計測手法へと変わりつつあり、素材開発に大きな助けとなる可能性を有しています。

本フォーラムでは、ここ数年で急速に発展してきた光電子分光・顕微技術をテーマに、その最先端の開発を行っている先生方にご講演いただきます。

日時

2024年
11月28日(木)
13:00 - 17:30

※ 途中休憩あり

会場 《ハイブリッド開催》

東京大学 柏キャンパス

物性研究所 6階 大講義室

《先着：150名まで》

オンライン配信 《先着：300名まで》

申込方法

以下URL、もしくは右のQRコードの申し込みフォームよりお申し込みください

<https://forms.office.com/r/TWiC8Wn8qM>



申込期限

2024年11月25日 (月)

15:00まで

主催：東京大学連携研究機構マテリアルイノベーション研究センター (MIRC)

協賛：東京大学国際オープンイノベーション機構 (IOI)

東京大学大学院工学系研究科附属ナノシステム集積センター (NANO HUB)

第7回 MIRCフォーラム プログラム

司会： **近藤 猛** (東京大学 物性研究所 准教授)

13:00	開会挨拶	廣井 善二	東京大学 物性研究所長
13:05	挨拶	田中 潤一	株式会社日立ハイテク コアテクノロジー&ソリューション事業統括本部 主管技師長
13:15	講演 1	松田 巖	東京大学 物性研究所 教授
「微小空間を探る未踏X線分光」			
13:55	招待講演	松下 智裕	奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授
「光電子ホログラフィによるドーパントや薄膜界面欠陥の立体原子配列の観測」			

休憩

15:00	講演 2	谷内 敏之	東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特任准教授 東京大学 物性研究所 リサーチフェロー
「ナノ物性イメージングのためのレーザー励起光電子顕微鏡」			
15:40	講演 3	榊原 慎	株式会社日立ハイテク ナノテクノロジーソリューション事業統括本部 専門部長
「半導体製造プロセスにおける材料特性のインライン検査・計測」			
16:10	閉会挨拶	霜垣 幸浩	東京大学 連携研究機構マテリアルイノベーション研究センター 機構長

インターバル

16:25	見学	【レーザーPEEM】	東京大学 総合研究棟
17:30	意見交換会		

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。

会場までのアクセス

つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅下車
路線バスにて8~15分、他タクシーなどをご利用ください。

柏キャンパス、および会場（物性研究所）までのルート詳細は、
右のURL、もしくはQRコードよりご確認ください。

柏キャンパスまで

<https://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/access/>



構内案内

<https://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/map/>

